

## 超高周波テスト治具の製作請負

株式会社高田RF技術研究所

超高周波デバイスのテスト治具（テストフィクスチャー、ソケットなど）をお客様のご要求に合わせて製作いたします。

### 基本技術

- 1) 異方性導電膜使用
- 2) 薄膜アルミナ基板 or 高周波用 PCB or 細線同軸ケーブルを使用
- 3) 豊富なメカ設計技術
- 4) 3次元電磁界シミュレーションによる設計検証
- 5) S-parameter 測定（～110 GHz）
- 6) TDR、アイパターン解析

### 特徴

- 1) 動作周波数：DC～100 GHz 程度
- 2) ファインパッド/ボールピッチ：最小 150  $\mu\text{m}$  程度（デバイスの外形公差に依存します）
- 3) RF 信号インタフェース：同軸コネクタ

### 測定対象物（例）

- 1) 表面実装デバイス（QFN、BGA など）
- 2) 高周波基板型素子（フィルタなど）
- 3) FPC インタフェースデバイス（ROSA、TOSA など）

### 基本構成

以下の部品で構成されます。

- 1) コンタクター：異方性導電膜
- 2) 信号伝送ライン  
DC～100 GHz 程度：薄膜アルミナ基板、細線同軸ケーブル  
DC～40 GHz 程度：薄膜アルミナ基板 or 高周波 PCB
- 3) 同軸コネクタ  
DC～110 GHz 程度：W(1.0mm)  
DC～90 GHz 程度かつマルチチャンネル：G3PO  
DC～65 GHz 程度：V(1.85mm)  
DC～65 GHz 程度かつマルチチャンネル：SMPM(GPPO)
- 4) デバイスガイド（測定物と基板とのX位置合わせ）
- 5) プレスユニット（異方性導電膜の最適圧縮量調整）